ตารางที่ 4.17

แสดงเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปร	$\overline{X}$	S.D.	SUCC	COMP	CRIT	OPPO	REAC	YEDU	EXPM	SKIL
SUCC	31.65	9.48								
COMP	3.24	1.06	.51**							
CRIT	3.99	0.94	.45**	.38*						
OPPO	2.71	0.86	.21	.43**	.21					
REAC	1.77	0.81	-.56**	-.41**	-.48**	.06				
YEDU	15.33	3.38	.36*	.22	.33*	-.07	-.35*			
EXPM	1.55	1.22	.35*	.43*	.13	.36*	-.12	.02		
SKIL	2.85	1.61	.21	.05	-.02	.20	-.04	.00	.29*	
PRIT	132.67	13.54	.04	.26	.47**	.10	-.26	-.01	-.06	-.03

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

SUCC หมายถึง ความสำเร็จ

COMP หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์

CRIT หมายถึง การวางแผนเฉพาะสิ่งสำคัญ

OPPO หมายถึง การแสวงหาโอกาส

REAC หมายถึง การตั้งรับ

YEDU หมายถึง ระยะเวลาในการศึกษา

EXPM หมายถึง ประสบการณ์ในการบริหาร

SKIL หมายถึง ความชำนาญในวิชาชีพ

PRIT หมายถึง เชาวน์เชิงปฏิบัติ